



## P-MEC Japan 2017 出展のお知らせ

名称：P-MEC Japan 2017（医薬品原料 機器・装置展）  
 会期：2017年4月19日（水）～21日（金）10：00～17：00  
 会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）  
 出展場所：東1ホール No. X-23  
 URL：<http://www.cphi-japan.com/>

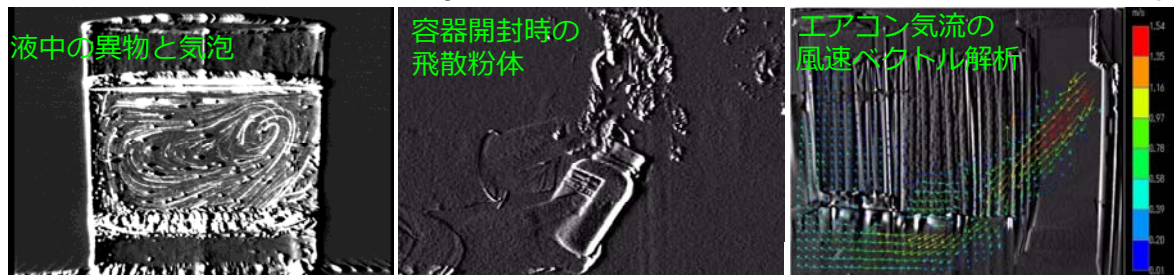


※上記 URL より来場事前登録[登録無料]をすることができます

### 世界最高水準の「微粒子可視化システム」を出展します



微粒子可視化システムによる撮影事例（当社ホームページに動画が掲載されています）



ヒット商品の「Dライト」はマイナーチェンジし、より使いやすくなりました！



表面異物観察用ツール **Dライト**



観察例：キーボードの汚れ

微粒子可視化システムは、80ナノメートルの浮遊粒子をリアルタイムに映像化できる世界最高水準の撮影感度をもった可視化装置です。国内外で、システムの販売、システムを利用した受託サービス（生産工程や製造装置内外における微粒子や気流の挙動調査、各種設備性能の評価など）を展開中です。

本展では、機材や各種ソフト、撮影事例動画を展示し、実際に微粒子可視化をご体感頂けるようにデモコーナーを設置します。また、様々な業界から高い評価を頂いており、昨年度は過去最大の販売台数となりました表面異物観察用ツール「Dライト」も展示します。微粒子可視化技術を会場では是非ご体感下さい。

<本件に関する問い合わせ先>

ビジュアルソリューション事業部    Tel: 03-3639-2206    E-mail: viest@snk.co.jp

～ 詳しくはホームページをご覧ください <http://www.snk.co.jp/particle> ～